Search Notes		

_	Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
	10/616,044	YANG ET AL.	
	Examiner	Art Unit	
	Luan V. Van	1753	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
205	291		
	296		
	157		
	29b 157 96		
			,

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
·		
•		/
•		
	-	
		1